

Seminar: Elektronikfertigung – neue Herausforderungen erfordern neue Wege

Schneller, besser, kleiner und dabei kostengünstiger – so lauten meist die Anforderungen an neue Produkte, die innerhalb immer kürzeren Abständen auf dem Markt erscheinen sollen. Wem das bekannt vorkommt, der ist auf dem Digitaltest-Seminar genau richtig. Unter dem Titel „Elektronikfertigung – neue Herausforderungen erfordern neue Wege“ sprechen Spezialisten aus verschiedenen Bereichen über Lösungsmöglichkeiten beim Testen, Board-Handling, Programmieren und Löten.

Das Seminar ist kostenfrei und findet mit limitierter Teilnehmerzahl an zwei verschiedenen Terminen und Orten statt. Die Inhalte sind an beiden Tagen die gleichen. Die Anmeldung erfolgt über die Digitaltest-Webseite.

- Seminar in **Remscheid am 15. Mai 2018**, 9:45-13:30 Uhr im Hotel Eschbachtalsperre [Anmeldung](#)
- Seminar in **Nürnberg am 18. September 2018**, 9:45-13:30 Uhr im Derag Livinghotel [Anmeldung](#)

Probleme beim Testen? So schaffen Sie Abhilfe

Das Testen von elektronischen Baugruppen kann die Produktion vor eine Vielzahl an Herausforderungen stellen. Diese können z. B. häufige Layoutänderungen oder schwierige Datenaufbereitung für Adapter sein. Vielleicht fehlen auch Spezialisten vor Ort und folglich leidet die Qualität, Fehler werden nicht gefunden und Reparaturen sind teuer. Dies sind nur einige der Herausforderungen, die das Testen in der eigenen Produktion erschweren können. Die Experten von [Digitaltest](#) zeigen, wie Lösungsmöglichkeiten hierzu aussehen.

Test-Handler: für mehr Vielfalt ohne Zeitverlust

IPTE Test-Handler wurden speziell mit dem Schwerpunkt entwickelt, die automatische Prüfung von Leiterplatten oder Baugruppen zu erleichtern – gleich ob in einer In-Line-Lösung oder als Stand-Alone-Maschine. Die platzsparenden Kontaktierstationen ermöglichen eine große Produktvarianz und dank der schnellwechselbaren Adaptersätzen, entstehen nur minimale Rüstzeiten. Welche Konzepte es hierzu gibt und wie Sie zur maximalen Ausbringung bei minimalen Zykluszeiten kommen, stellen die Experten von [IPTE](#) vor.

Flashen in Höchstgeschwindigkeit ist keine Hexerei!

Die neueste Programmieretechnik macht es möglich, bis zu 16 unterschiedliche Bausteine gleichzeitig zu programmieren. Dies erhöht nicht nur den Durchsatz, sondern senkt zudem die Kosten des gesamten Produktionsprozesses. Eine bedienerfreundliche Benutzeroberfläche erlaubt es außerdem, innerhalb kürzester Zeit ein produktionsstaugliches Programm zu erstellen. Informieren Sie sich im Vortrag von [pb tec solutions](#) über alle

weiteren Besonderheiten und Vorteile dieser Technologie am Beispiel des neuen Flashrunner 2.0 von SMH.

So gelingt porenfreies Löten

Um die Herausforderungen der heutigen Elektronikfertigung zu meistern, gehören hochfeste nahezu porenfreie Lötverbindungen mit dazu. Poren in einer Lötstelle müssen deshalb auf ein zulässiges Minimum reduziert werden. Die Spezialisten von [SMT](#) zeigen, wie Lunker in Lötstellen entstehen und wie Sie diese reduzieren können. Außerdem sprechen sie über das Prinzip des Vakuumprozesses und wie mittels Vakuum die Zahl der Hohlräume in Lötstellen minimiert werden.

Über Digitaltest

Als starker Partner der Elektronikindustrie entwickelt und produziert Digitaltest automatisierte Testsysteme (ATE) für elektronische Leiterplatten, Software für die Automatisierung der Produktion und Qualitätsmanagement-Systeme. Digitaltest steht für innovative Lösungen zur Optimierung des gesamten Herstellungsprozesses – als Schnittstelle zwischen CAD, den Testverfahren und der Produktion selbst. Digitaltest bietet zusätzlich umfassenden Service und Support, bis hin zum kompletten Outsourcing von Leiterplattentests an Standorten weltweit.

Über 35 Jahre Spitzentechnologie, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit in Sachen automatisierte Testsysteme.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Sarah Boctor-Vauvert
Marketing Director
E-Mail: sarah.boctor-vauvert@digitaltest.de
Telefon: +49 (7244) 96 40 -24

Digitaltest GmbH
Lorenzstraße 3
76297 Stutensee

www.digitaltest.com